

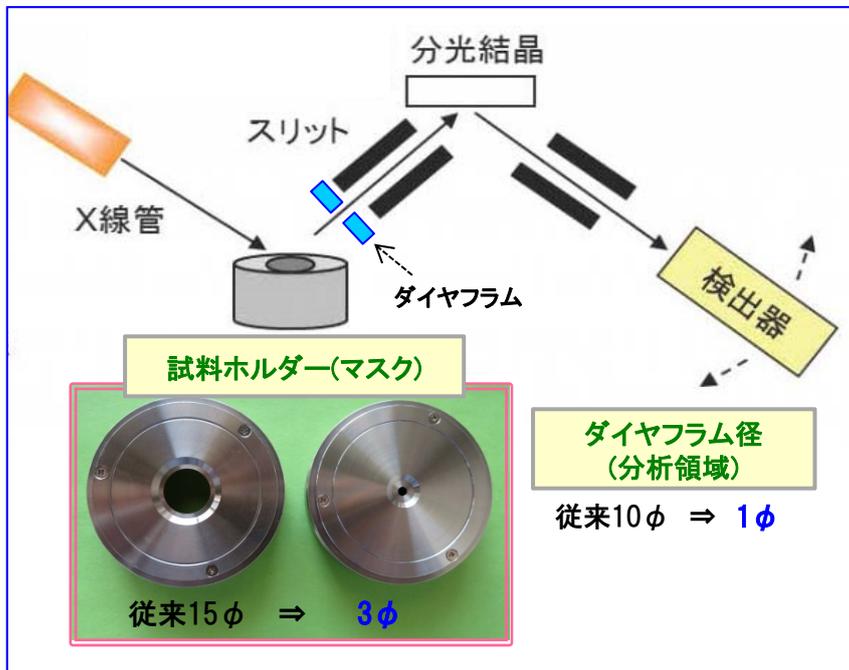


電子部品などの微小試料の蛍光X線分析

Φ3mm程度の小さな対象物について、精度よく組成分析を行います。

微小試料での蛍光X線分析(波長分散型)の概要

- 電子部品やパーツの欠陥、異物は対象が小さいため組成を知ることが困難です。本技術では問題のある部分に対して外部からX線を照射するため、簡単且つ精度良く成分を調べることができます(分析領域はΦ1mm)。
- 電子部品の微小部位をはじめ、ティアダウン(実装部品評価)やモーターコア(絶縁被膜組成)、磁石(希土類組成)など微小試料しか採取できない場合の分析などにご利用ください。



試験仕様

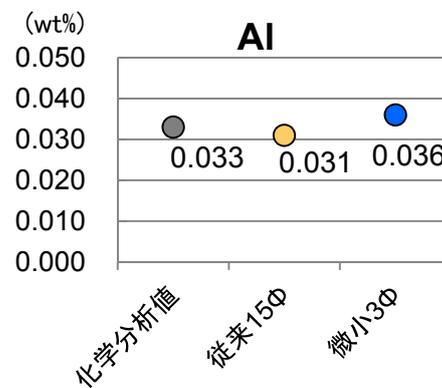
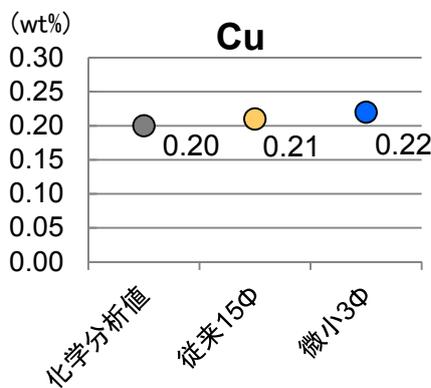
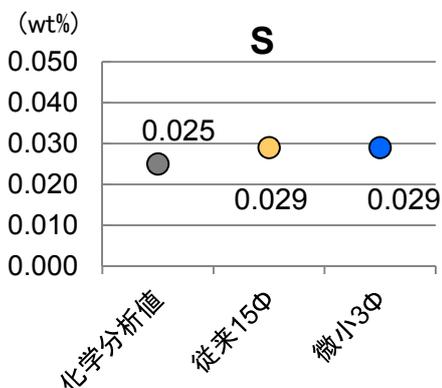
- 装置: 波長分散型蛍光X線分析装置
- 試料形状: 3mmφ以上の個体
- 半定量分析方法: FP法(装置内での理論計算法)
- 分析領域: 1mmφ
- 測定元素: 原子番号7(N)以上

特徴

- 1mmφの微小領域の表面平均情報を分析可能です。(EPMAは200μm程度以内の局所分析が可能です)
- 蒸着処理が不要なため、プラスチック等の非導電物質を容易に分析できます。
- 波長分散型なので、分析の判定精度は数百ppm程度と高精度です。

分析結果の例 標準物質について、標準値(化学分析値)と比較

- 微小試料での分析判定精度は従来と同等です。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2019 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。